交流法を用いた低温高圧カ下比熱測定

広島大学大学院先端物質科学研究科 梅尾和則

1. はじめに

比熱は磁気転移や超伝導転移などの相転移現象 やその系の基底状態を知る上で重要な物理量であ る。近年、希土類元素やウランを含む化合物の磁 気秩序を圧力で抑制した磁気臨界点近傍で、比熱 や帯磁率がフェルミ液体論の予想とは異なる温度 変化を示す非フェルミ液体的挙動や、圧力誘起超 伝導が発見され[1]、低温、高圧力下の比熱測定の 必要性がますます高まっている。しかし、電気抵 抗や帯磁率が数+GPaの高圧力下で常圧下と同程 度の精度で測定されているのに対し、比熱はまだ 数 GPa 以下で測定されているに過ぎず、その精度 も十分とはいえない。現在、圧力下での比熱測定 には主に断熱法と交流法が用いられている。

交流法には次の2つの利点がある[2,3]。

(i) 試料の量が微少でよい。

(ii) 原理的に試料を断熱状態にする必要がない。

本稿では、セリウムを含む金属間化合物の 10 K 以下の比熱を圧力下で測定するために、私が開発、 改良してきた交流法による高圧力下比熱測定装置 について具体的な測定例を含めて詳細に解説する。 さらに、その利点と問題点を述べる。

2. 交流法の原理

まず、常圧下での交流法による比熱測定の原理 について簡単に紹介する。詳しい説明は他の論文 や解説記事を参照されたい[2,3]。

交流法は試料に角周波数 ω の交流熱流を加え、 その応答で生じる試料温度の振動の振幅を測定す ることにより、熱容量を測定する方法である。Fig. 1に交流法の熱的モデルを示す。熱容量 Cs、熱拡 散率Dの試料が熱抵抗Rで熱浴と熱接触している。 試料には熱容量がそれぞれ $C_H \ge C_{\theta}$ のヒーターと



Fig. 1. 交流法の熱的モデル

温度計が熱抵抗 $R_{\rm H}$ 、 R_{θ} で熱接触している。ヒー ターから試料に交流熱 $P(t) = P_0(1 - \sin(\omega t))を加$ $えると、定常状態では試料の温度は熱浴より <math>T_{\rm dc}$ だけ上昇し、その上下に振幅 $T_{\rm ac}$ で振動する。こ の $T_{\rm ac}$ は Fig.1 についての熱伝導方程式を解く事に より、次のように求められる。

$T_{\rm ac} = (P_0 / \omega C) [1 + (\omega$	$\tau_{int})^2 + (\omega$	$\tau_{ext})^{-2} + K]^{-1/2}$	2
$= (P_0/\omega C)F(\omega)$			(1)
$C = C_{\rm S} + C_{\rm H} + C_{\theta}$			(2)

ここで τ_{int} は試料内に熱が伝わる速さを示す時 定数、 τ_{ext}は試料から熱浴へ熱が伝わる速さを示 す時定数である。*K* は角周波数に依存しない定数 である。試料の厚さを *d*とすると、それぞれの定 数は次のように表される。

$$\tau_{\text{int}} \approx \left[\left(d^2 / D \right)^2 + \left(R_{\text{H}} C_{\text{H}} \right)^2 + \left(R_{\theta} C_{\theta} \right)^2 \right]^{1/2}$$
(3)

 $\tau_{\text{ext}} = RC$ (4)

$$K \propto \tau_{\text{int}} / \tau_{\text{ext}}$$
 (5)

交流法では次のような条件(交流法の条件)を 満たすωで比熱を測定する。

^{〒739-8530} 東広島市鏡山 1-3-1 広島大学大学院先端物質科学研究科 量子物質科学専攻 物質基礎科学講座磁性物理学 Department of Quantum Matter, ADSM, Hiroshima Univ. 1-3-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima 739-8530 kumeo@sci.hiroshima-u.ac.jp

$\omega \tau_{int} \ll 1$	(6)
---------------------------	-----

 $\omega \tau_{ext} \gg 1$

(6)は試料内の温度が一様のままで周期的に変 化する条件であり、(7)は *T*ac が減衰しない条件で ある。二つの条件が成り立つ時、(1)式の F(ω)は 1 と近似され、温度計、ヒーターを含めた試料部 の比熱は次式で求まる。

 $C = P_0 / \omega T_{ac}$

(8)

(7)

交流法の条件を満たすためには、試料の厚さ dが小さいほうが、 τ_{int} が小さくなり有利である。 熱拡散率Dにもよるが、10K以下での金属試料の 場合ではdの値は最大 1~2mm 程度である。また、 常圧の測定では、試料の周りに低圧のヘリウムガ スを入れて τ_{ext} が数秒から数十秒になるようにRの値を加減している。ここでは詳しく述べなかっ たが、ヒーターから試料に加える交流熱と試料温 度の交流成分との位相差は交流法の条件が満たさ れた場合、 $\pi/2$ となる。このことから、逆にその 位相差を測定すれば交流法の条件が満足されてい るかどうかを判別することが出来る。

交流法では、試料と熱浴の間の熱抵抗 R が有限 であるため、試料に加わる交流熱の正確な見積も りが難しい。そのため、熱容量の確度が断熱法な どに比べて良くないのが欠点である。

高圧カ下の測定

断熱法による圧力下比熱測定では圧力容器ごと 試料の比熱を測定するので、圧力容器の比熱を差 し引く必要がある。これに対して、交流法では、 上記の原理で述べたように、試料、温度計、ヒー ターを圧力容器内に入れ、試料のみの比熱を測定 する。この場合、熱浴は圧力容器であり、圧力媒 体を通して試料と熱交換する。したがって、交流 法の条件が満足するような圧力媒体の選択が重要 となる。

その圧力媒体の性質としては、

- (i) 熱容量が試料に比べ無視できるほど小さい こと。
- (ii) 適度な熱抵抗 *R* をもっていること。

である。圧力下電気抵抗測定などで使用されるオ イルやアルコール系の圧力媒体はデバイ温度が低 く、低温での熱容量が大きいので不適である。一 方、圧力媒体に高圧気体を用い、交流法の条件か らのずれを厳密に実験的に求めて、(1)式から比熱 を 100K 以上で測定した例も報告されている[4]。 しかし、その方法は 10K以下では使えない。

Eichler と Grey [5]は 10K以下の低温でこれらの 条件を満足させる圧力媒体としてダイヤモンド粉 末を使用した。ダイヤモンドはデバイ温度が高い ので低温で比熱が小さい。また、粉末にして熱抵 抗を増加させ、(7)の条件を満足するωを決めるこ とが出来る。

しかし私の初期の経験では、硬いダイヤモンド を圧力媒体に用いることで試料には非静水圧が加 わることが問題点であった。また、ダイヤモンド 粉末の中では、通常使用されるマンガニン線のよ うな圧力計は使用できない。さらに、高圧力下で は試料全体を取り囲む圧力媒体からの熱リークが 無視できないため比熱の確度が悪くなることが予 想された。そこで、私は試料をインジウム金属(In) で包むことによってこれらの問題点の改良を試み た。そのポイントは次の3点である。

- 常圧下で In は 3.4K で超伝導転移を示し、 その転移温度の圧力効果から試料に加わっ た圧力を直接測定できる。
- ② 常圧下での超伝導転移温度での比熱の跳び を文献値[6,7]と比較することで、比熱の絶 対値が較正できる。
- In は比較的柔らかいので、非静水圧性の緩 和が期待できる。

Fig. 2 に私が開発した比熱計の断面図を示す。 ヒーターには電気抵抗の温度変化が小さいモレキ ュロイ線(直径 25 μ m)を櫛型に折り曲げたもの を使用した。抵抗は 60 Ω程度である。温度計に は KOA 社製 RuO₂厚膜抵抗(1×0.5×0.35 mm³, 3.8 kΩ)を用いた。この抵抗体はアルミナ基盤の 上に焼付けられているので、そのまま使用すると 温度計の熱容量 C_{θ} が大きくなり、 τ_{int} が増して測 定が困難になる。また、不要なバックグラウンド が増える。そこで、そのアルミナ基盤の厚さを 0.1 mm まで削り、温度計の質量を 0.8 mg まで小さく した。ヒーターと温度計のリード線は直径 50 μ m



Fig. 2. 試料付近の断面図

のマンガニン線を使用した。このリード線は電極 プラグからの Cu 線 (50 μ m) とダイヤモンド粉 末中で接続している。試料は直径 2.5 mm、厚さ約 0.2 mm の円盤状に整形し、温度計、ヒーターと ともに直径 3 mm の In 盤の間に挟み込んだ。使用 した In の質量は 20~30 mg、試料の質量は 2~10 mg であり、In を含めた全体の厚さは約 1 mm 程度 である。温度計、ヒーターと In との電気的絶縁の ために、それそれの間に厚さ 15 μ mのカプトン箔 を挟んだ。

ダイヤモンド粉末としては研磨剤として市販さ れている粒度 2~4 µ mのものを使用した。テフロ ンセルにダイヤモンド粉末を単に入れるだけでは 充填率が低く、圧力をかけた際、試料部が大きく 変形してヒーターや温度計が破壊される。そこで 試料部をセットする前にダイヤモンド粉末だけを lton 程度の荷重をかけて押し固めた。

圧力発生にはクランプ式ピストン・シリンダー 型圧力容器を用いた。シリンダーは硬化処理した Be-Cu製、ピストンはWC製である。シリンダー にはRuO2抵抗温度計を較正するためにGe抵抗温 度計が熱接触させてあり、各圧力ごとに圧力下の 温度計を較正した。圧力容器は³He クライオスタ ットに取り付けられ、0.3K まで冷却された。温度 計の抵抗 r の温度微分 d r/dT は加圧とともに減少 した。その減少率は低温ほど大きく、0.3K では 1GPa で常圧の約 40%減少する。2GPa までは問題 ないと思われるが、さらに高圧力下の測定では工 夫が必要であると思われる。

温度の交流成分の検出にはロックインアンプ

(5610B, (株) NF 回路設計ブロック)を用いた。 測定の前に、4.2K, 1.5K, 0.3K で $\tau_{int} \geq \tau_{ext}$ を測 定し、交流法の条件を満たす周波数をおおよそ決 定している。 τ_{ext} は試料に一定の熱を加えて定常 状態に達した後、加熱を止めてから試料温度が熱 浴の温度に緩和していく過程を測定することで求 めた。 τ_{int} は T_{ac} の周波数依存性の結果に(1)式を フィッティングすることで求めた。中間の温度で は、交流熱と試料温度の交流成分の位相差が $\pi/2$ となるように周波数を変えた。熱容量は(8)式から 算出した。

4. 測定例

我々は上記の方法を用いて、重い電子系反強磁 性体 Ce₇Ni₃ [8], CePdAl [9], Ce₂Rh₃Ge₅ [10]の圧力 下比熱測定を行ってきた。ここでは Ce₇Ni₃ を例に 測定結果の詳細について述べる。

Fig. 3(a)に常圧の Ce₇Ni₃の比熱測定結果を C/T 対 Tで示す。Ce₇Ni₃を取り除いた場合のデータは In およびアデンダとして温度計とヒーターなどの C/Tである。Ce₇Ni₃と In の質量はそれぞれ 3.22 mg、 20.31 mg であった。この測定の際の τ ext は 50 s~ 100 s、 τ int は 0.01 s~0.05 s であった。測定周波数 は 1~2 Hz とした。どちらの結果にも 3.4K に In の超伝導転移に起因した比熱のとびが観測されて いる。試料を除いた場合の比熱の値は In の文献値 [6,7]と比べ 10%程度大きく、この差がアデンダの 熱容量である。Ce₇Ni₃の 2K 付近での比熱異常は 反強磁性転移に起因する。

Ce₇Ni₃ 試料を含んだ結果から、それを含まない 結果を差し引くことによって、試料の比熱を算出 した結果を Fig.3(b) に示す。参考までに、断熱法 で測定した結果[11]と Sereni らが測定した結果 [12]をあわせて示している。交流法で測定した結 果は断熱法と 10%程度の誤差でよく一致してい



Fig. 3 高圧力下交流法比熱測定装置で測定した Ce₇Ni₃の常圧下の比熱。(a)生データと試料 を含まない熱容量。(b) Ce₇Ni₃の比熱。

る。Sereni らの結果と若干異なるのは試料依存性 に起因すると考えられる。

Fig.4にいろいろな圧力下で測定した Ce7Ni3の 比熱の温度変化を示す[10]。縦軸の Cmは比熱の格 子振動の寄与としてLa7Ni3の比熱を差し引いた値 である。常圧の反強磁性秩序に起因した比熱異常 は圧力増加とともに低温側へシフトしている。帯 磁率などの測定結果から磁気秩序が消失する圧力 Pcは0.39GPaと見積られた。その圧力に近い0.38 **GPa**では広い温度範囲で *C*_m/*T* が-log*T* に比例する 非フェルミ液体的挙動が見られる。しかし、Pc以 上の 0.62 GPa 以上では低温で C_m/T が温度変化し ないフェルミ液体的挙動が回復している。このよ うな圧力依存性は断熱法で測定された Ce-Ni₃の圧 力変化の結果[13]と良い一致を示した。図中の実 線はスピン揺らぎの SCR 理論による計算結果で、 この物質の磁気臨界点近傍の比熱は SCR 理論で 説明できることを示している。



Fig. 4 圧力下における Ce_7Ni_3 の比熱の磁気的寄与 C_m の温度変化。

4. おわりに

これまで述べてきたように、交流法を用いて 1 ~2GPa の圧力下における比熱の精密測定が可能 である。特に純良な試料が少量しか得られない場 合は交流法が有効である。しかし、本稿で述べて きた方法は In を圧力媒体として静水圧性を向上 させたとはいえ、異方的な圧力に敏感な試料の場 合はその非静水圧性の影響が現れる。この圧力媒 体の問題はさらに改良すべき点である。完全な静 水圧性を実現することは難しいが、逆に一軸性加 圧下における比熱測定にも交流法は容易に応用で きる[14]。

また、交流法は圧力媒体や温度計を工夫すれば、 ブリッジマンアンビルセルやキュービックアンビ ルセルなどの他の高圧発生装置に応用できる。ご く最近、まだ比熱の絶対値までは決定できてない ようであるが、ダイヤモンドアンビルセルやブリ ッジマンアンビルセルを用いて 8 GPa までの比熱 測定も報告されている[15,16]。このように交流法 による比熱測定は微少試料の測定が可能であると いう特徴を活かし、さらに高圧力領域で応用され るであろう。

5. 謝辞

交流法による高圧力下比熱測定装置の開発においては門松秀興(故人)、野村基之両氏から有益な助言を頂いた。また、Ce化合物の比熱の圧力効果の研究は広島大学大学院先端物質科学研究科の越前勇次、高畠敏郎両氏との共同研究である。また、測定は広島大学低温センターで行った。本研究の一部は文部科学省の科学研究費補助金(奨励研究(A))の援助を受けて行った。

参考文献

- [1] G. R. Stewart, Rev. Mod. Phys., 73, 797 (2001).
- [2] 日本熱測定学会編「熱量測定・熱分析ハンドブ ック」p.68
- [3] 八田一郎, 生嶋明, 固体物理, 5, 471 (1970).
- [4] J. D. Baloga and C. W. Garland, Rev. Sci. Instrum., 48, 105 (1977).
- [5] A. Eichler and W. Gey, Rev. Sci. Instrum., 50, 1445 (1979).
- [6] C. A. Bryant and P. H. Keesom, Phys. Rev. 123, 491 (1961).
- [7] H. R. O'Neal and N. E. Phillips, Phys. Rev. 137, 748 (1965).
- [8] K. Umeo et al., J. Phys.: Condens. Matter, 8, 9743 (1996).
- [9] S. Hane : Dr. Thesis, ISSP, Univ. of Tokyo, (2001).
- [10] K. Umeo et al., Phys. Rev. B64, 144412 (2001).
- [11] K. Umeo et al., J. Phys. Soc. Jpn., 66, 2133 (1997).
- [12] J. G. Sereni et al., Physica B 199-200, 567 (1994).
- [13] K. Umeo et al., Phys. Rev. B58, 12095 (1998).
- [14] K. Umeo et al., Phys. Rev. B60, R6957 (1999).
- [15] A. Demuer et al., J. Low Temp. Phys., **120**, 245 (2000).
- [16] F. Bouquet et al., Solid State Commun., 113, 367 (2000).